

SEM/EPMA・表面分析ユーザーズミーティングへの参加

報告者	松井春美	報告日時	令和4年10月17日(月)
実施場所	梅田スカイビル・ステラホール	実施日時	令和4年10月6日(木)～7日(金)
参加職員数	1名		

・報告

大阪で開催された日本電子株式会社主催の第15回SEMユーザーズミーティングと第41回EPMA・表面分析ユーザーズミーティングに参加しました。1日目のSEMユーザーズミーティングでは、試料作製や観察と解析・分析手法のセミナーに加え、最新機器に関するポスター展示がありました。2日目のEPMA・表面分析ユーザーズミーティングでは、EPMAの分析手法に加えXRFとSXESに関するセミナーとともに、CT等のセミナーでは紹介されなかった機器のポスター展示がありました。特にポスター展示の際に、カタログからだけではわからない情報を直接メーカーの方に伺うことができ、大変有意義な情報を入手することができました。

・詳細

今回の出張での収穫といえる情報は特に3点でした。1つめは試料ホルダーに関する情報で、ポスター展示のブースで購入を検討したいと思えるものを直接手に取ることができました。ちょうど優待販売キャンペーンも行っているようなので、検討したいと思います。2つめは蛍光X線分析装置(XRF)用カプセルに関する情報で、1日目のポスター展示で担当者にお話を伺うことができたことに加え、2日目のセミナーで使用方法について詳細を知ることができました。3つめはエネルギー分散型X線分析検出器(EDS)の情報についてで、装置更新の際にはまたご相談したいと思います。